

電磁相容檢測技術研討會會議紀錄

開會時間：九十二年三月十一日

開會地點：電氣檢驗科技大樓簡報室

主持人：謝科長翰璋

出席人員：詳如簽名單

會議決議：

1. 自92年4月1日開始，測試照片、產品內部及結構照片應以清晰為原則，EMI對策元件、電路板上零件及layout不可模糊，照片須可拍出IC編號。
2. 電路板零件無法清楚拍攝時，應對電路板各部分作個別特寫；若實際上有困難無法拍出IC編號，應將編號敘述在照片旁邊。
3. 產品自進實驗室開始，至完成測試發行報告，期間所做的對策元件，不論是廠商或實驗室所為，皆應在對策元件一覽表及測試報告中敘述清楚。
4. 對策元件一覽表應能指示出每個對策元件所在的照片、照片中的位置，且在照片上特別標示出來，使得其間可清楚地對應。
5. 本局網站上之EMC申請案件查詢程式、單機版程式，若有相關問題，請洽本局資訊室查詢。
6. 本局已公告CNS13783-1標準90年1月30日版，實驗室執行家電產品測試時，請使用新版標準。
7. 鑒於舊版資訊產品EMI測試程式，可能無法完全測試所接的週邊，實有檢討更新的必要，請各實驗室於一星期內，提供相關資料給本科龔子文先生，以進行整理改進。
8. 本科現正發展一套視訊會議系統，以作為實驗室聯絡公務之用，請有興趣參與系統測試的實驗室與本科陳誠章先生聯絡。
9. Cisp22 2000版，請教各位先進是否有問題，希望各實驗室利用BSMI會議上討論。
決議：由於新版CISPR22加入了ferrite clamp method，請各實驗室針對此測試方法收集相關資料回覆給本科，再進行討論。
10. USB 2.0週邊市場上很少，請教各實驗室如何接(以一月份BSMI要求要接一半以上)？
決議：本議題將由本科實際check各實驗室測試情況後，再進行討論。
11. 根據 貴局九十年十二月五日電磁相容檢測技術研討會會議紀錄，宣告事項第三項之一般電熨斗之Click量測方式乃依據7.3.4.11節量測，若本公司產品之Click符合4.2.3.4之條件，可否依4.2.3.4量測？如蒙賜準，可否列入會議紀錄並即時生效？
決議：家電產品若符合CNS13783-1標準4.2.3.4節之測試條件(喀啞率 $N \leq 5$ ，且每一個click持續時間 $\leq 10\text{ms}$)，依據標準便可視為符合click限制值。
12. 代TEAC詢問下列問題，若僅開發有特殊介面轉換板的NOTEBOOK用之CD-ROM DRIVE，EMI測試方面可否再追加一組介面轉換板，用一般PC來測試並行符合性聲明，待相對應的NOTEBOOK於台灣市場上販賣時，再次實施EMI測試來做DOC驗證？
決議：同意辦理。

備註：下次會議日期暫定九十二年四月十五日